

Microwave Lifetime Tester (u-PCD): 矽晶片

或晶棒 Lifetime 測試機:

以微波方式，量測載子在矽結晶中分離與結合的時間，以確認矽晶片的品質。無論單晶或多晶的矽晶片或晶棒的進出貨檢驗均適合使用。

- 機種:
1. Portable type for Ingot and wafer
 2. Wafer Mapping type for 5" & 6" wafer
 3. Ingot mapping type for Ingot

